

1. Record Nr.	UNISA996279995003316
Titolo	2013 IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems (DFTS) // IEEE Staff
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, NJ : , : IEEE, , 2013
ISBN	1-4799-1585-8 1-4799-1584-X
Descrizione fisica	1 online resource
Disciplina	621.3815
Soggetti	Integrated circuits - Very large scale integration Integrated circuits - Fault tolerance
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia